

超音波精密走査面探傷システム

—微細きず検出用超音波探傷装置—



探傷画面

バーストパルサー

集束探触子

探傷システム一式

本装置は、微小ピッチの水浸超音波探傷装置IS-350※1とバースト波発生装置※2を組み合わせた試験体中の微細なきずの検出に適した装置です。モータ走査と集束探触子による高い方位分解能バースト波発生装置による高エネルギーの探傷が可能で、精緻な2次元損傷分布が得られます。

※1 インサイト㈱製 ※2 東亜非破壊検査㈱製

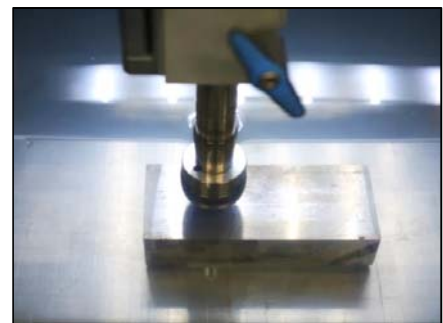
特長

- 手法：全没水浸法による垂直1探触子法によるパルス反射法
- 表示：平面画像(Cスコープ)
- 走行：モータによる電動送り
- 走行方向：XY2軸平面方向
- 記録：デジタルデータ
- 電源：100 V
- 検出限界： $\phi 50 \mu\text{m}$ 平底加工穴

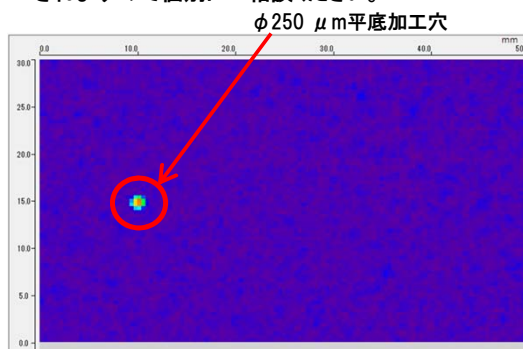
適用

- 探傷ピッチ：0.1~2.0 mm
- 探傷可能深さ：5~25 mm (鋼の場合)
- 試験体厚さ：5~40 mm (鋼の場合)
- 試験体面積：290 mm×130 mm以内
- 試験片重さ：20 kg以内

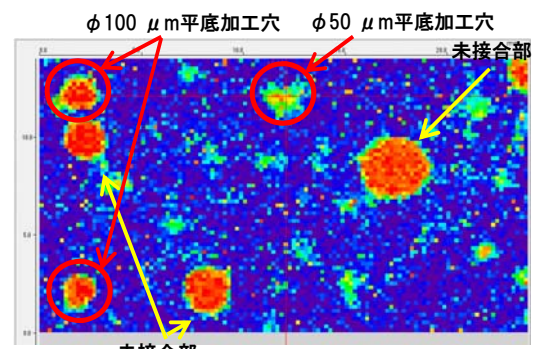
※ 適用可能な寸法、探傷深さは試験体の材質や形状に左右されますので個別にご相談ください。



試験体探傷状況



50 mm×30 mm 探傷ピッチ0.4 mm



24 mm×14 mm 探傷ピッチ0.2 mm

探傷画像